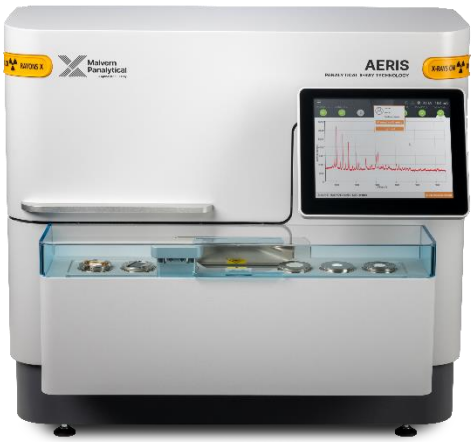
Fecha:	Mayo 21 de 2026
Empresa:	ITM
Ciudad:	
Dirección:	
Contacto:	Estefanía Correa Muñoz
E-mail:	ecorream@ufpso.edu.co
Teléfono:	

N° de Oferta:	17689E
Entrega:	18 semanas
Validez:	90 días
Moneda:	COP
Términos de negociación:	DDP

Respetados Señores:

CECOLTEC SAS, como representante de Malvern Panalytical (www.malvernpanalytical.com) se complace en presentar las siguientes referencias para su consideración:

DRX Aeris



XRD made easy

Meet Aeris – our brand-new X-ray benchtop diffractometer. Aeris will impress you with data quality and speed of data acquisition so far only seen on full-power systems. The instrument is accessible for everyone with its built-in touch screen and intuitive software. Being a Malvern Panalytical product guarantees delivery of the best benchtop data and full automatability for industrial applications.

Strong and robust

- Rugged design
- The only benchtop XRD instrument with external sample loading for ultimate dust protection of the heart of the instrument.
- Minimum of infrastructural requirements

- No cooling water, no chiller, no compressed air - the only thing you need is a single-phase power socket. Industry-ready
- Compatible with all common industry standards; from LIMS interfacing protocols to various industry standard sample holders.



An easy Touch

The most intuitive X-ray diffractometer with the built-in touch screen your results are always just a few taps away:

1. Place your sample
2. Select measurement program
3. View results



PIXcel1D MPX3



Medipix technology as a dedicated strip detector
With the PIXcel^{1D} detector you have a dedicated strip detector for 0D and 1D applications. You can measure up to 255 times faster than with a traditional point detector, without compromising data quality. With no need for cooling water, liquid nitrogen flow, counting gas or time-consuming calibrations it is a cost-effective solution.

From X-ray powder diffraction to high-resolution thin film studies

The PIXcel^{1D} covers a wide range of 1D applications requiring the medium and lower energy radiation wavelengths namely Cu, Co, Fe, Mn, Cr:

- Phase identification and high throughput screening
- Standardless quantification of mixtures of phases
- Refinement of crystal structures
- Phase transitions at non-ambient conditions in combination with our in situ stages
- Residual stress, texture and phase identification of metals and alloys
- Powder diffraction from large unit cell crystals
- Thin film studies.

Specification

Type	PIXcel^{1D} detector with Medipix3
Window size	14 mm x 14 mm
Efficiency Cu K	>95%
99% Linearity range	0 – 6.5 x 10^9 cps – Overall 0 - 25 x 10^6 cps - Column
Energy resolution around Cu K	18%
Maximum count rate	Maximum count rate 30 x 10^9 cps – Overall 120 x 10^6 cps - Column
Maximum background	<0.5 cps - Overall
Active length	14 mm
Smallest step size	0.0016° 2θθ at 240 mm goniometer radius
Supported wavelengths	Cu, Co, Fe, Mn, Cr
Defective channels	0

Software HighScore Plus



The ideal tool for crystallographic analysis and more

Whether you are interested in improved process control, or doing research and development, understanding your materials starts very often with understanding the powder diffraction pattern. After identification of all phases present in your sample with Malvern Panalytical's HighScore, this allin-one software suite with the Plus option continues to support you with your analysis. Whether your focus is on quantification with or without the Rietveld method, profile fitting, or pattern treatment; HighScore Plus is the solution and helps you performing your daily analyses.

A continuously developing package
We continuously innovate and update the HighScore suite to offer you the most comprehensive userfriendly toolbox for XRD. In the newest release (version 4.8) of the Plus option various new functions have been added:

- Superflip now shows a graphical representation of the electron density
- Best space group determination algorithm on the market: ExtSym [1]
- Generalization of the Finger-Cox-Jepthcoat asymmetry description for all profile functions
  Comprehensive crystallographic analysis

HighScore with the Plus option contains four classical indexing routines (Ito, Dicvol, Treor or McMaille). The unit cell refinement includes zero offset or sample displacement. The space group test is performed on either the full profile (Le Bail fit) or on indexed peaks. A Pawley fit to refine lattice parameters is another possibility. Lattice and structure transformations as well as cell reductions are supported. An automatic standardization of non-standard space group settings is possible while loading such structure data. The symmetry explorer tool contains the crystal symmetry, point- and Laue group, reflection conditions and special positions of all 230 standard space groups. Additional data covers the about 150 nonstandard space groups used in the ICSD structure database.

Automatic classification or cluster analysis
HighScore with the Plus option makes large volume data processing fast and easy.
Cluster analysis automatically sorts all scans of an experiment into closely related clusters and marks the most representative scan of each cluster, as well as outliers. This is useful for non-ambient experiments, mining samples and soil mapping, highthroughput screening campaigns and for monitoring the uniformity of industrial products.
A principal component analysis (PCA) helps to visualize the mathematically determined clusters. It shows confidence areas around each cluster.
The visual comparison of all scans in a cluster is possible as well as the distribution of clusters (on a measuring grid, on a well plate) is shown.

Structure viewing
With the 3D structure plotting functionality, you can choose the colors of atoms, polyhedral viewing, and shift, turn, roll and zoom the structure in order to obtain the best view.

Structure solution
HighScore with the Plus option supports the charge flipping algorithm and difference Fourier plots for determination of the crystal structure from powder diffraction data.

Rietveld/structure refinements
HighScore with the Plus option has many advantages for Rietveld refinements.
Automatic strategies and batches support the novice user to perform quantitative phase analysis, including the determination of an amorphous component. The refinement control displays a complete picture of all parameters, limits and constraints involved.
Range checking and automatic or manual constraints ensure the stability and reproducibility of the refinements. No parameter turn-on sequence is required, the proprietary solver takes care of this. Three profile functions including a true Voigt function are supported, which is especially important for crystallite size-microstrain determinations. Le Bail fits are possible and hklphase fits support the inclusion of unknown structure phases. The 'superflip' algorithm by L. Palatinus is included to solve crystal structures from high-quality powder data.

HighScore Plus supports the simultaneous use of multiple reference databases. You can search through inorganic and organic databases in one go. All types of reference databases, from actual to legacy, from

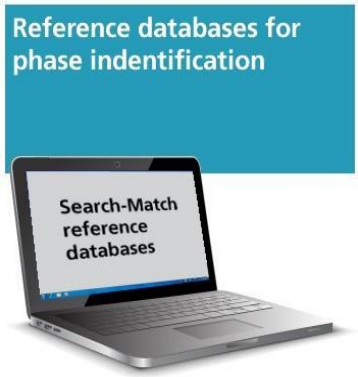
premium-quality ICDD products over midpriced solutions to free downloadable databases are supported. HighScore Plus is designed for the Windows 10, Windows 8 and Windows 7 Professional (64-bit) operating systems. Recommended configuration

- Processor: 64-bit dual or quad core, 3.40GHz, 6MB, or better
- Internal memory: 2 Gbyte (2-4 Gbyte for simultaneous analysis of many scans like in screening experiments)
- Free hard disk space: 10 Gbytes (or more) depending on the amount of data and on the reference database(s)
- A super VGA monitor (17 inch or more) with a desktop area of 1024*768 pixel. Multiple monitors within the HighScore application are supported.

Multiple monitors within the HighScore application are supported.

Phase identification by X-ray diffraction means comparing unknown measured data with known reference data. This reference data is usually taken from one or several databases. The comparison process is often called search-match as well.

The quality and the contents of the different reference databases vary considerably, depending on the data quality and on the editorial process. Generally speaking there is a relation between price and quality.



Measured and calculated reference data
Measured reference patterns often score better for phase identification. The data source is a real powder diffraction measurement made on a pure, carefully selected and characterized material. This is possible even when the crystal structure is unknown. Some databases contain the original powder scan (reference scan) next to the stick pattern.

Calculated reference patterns always come with crystal structure data, as required for Rietveld refinements or structure analysis. The data source is a single crystal experiment most of the time. The theoretical stick pattern is calculated from the crystal structure, and, sometimes, optimized for searchmatch.

Commercial and free reference patterns
The reference patterns in the commercial databases have gone through a profound editorial process with automatic checks on data quality and consistency. They have quality marks and cross references attached and they are reedited from time to time. Typical examples are the PDF2 (measured data) and the PDF4+ (measured and calculated data) products from the ICDD.

A free reference pattern is either just a measurement of a pure phase used for search-match purposes; or it is calculated from a known (single) crystal structure. The quality is usually not documented and often lots of additional (physical and chemical) data are absent. Collections of free measured reference patterns are often small and serve dedicated purposes like for instance kidney stone characterization.

Crystal structure only databases
These databases cannot be used directly for phase identification. Typical examples are the commercial ICSD and the free COD crystal structure databases. They are used for standardless phase quantifications with the Rietveld method.

A free-of-charge alternative is based on the COD crystal structures and can be downloaded ready for use, from the COD webpage.
Collections of free calculated patterns can be big. Their size only depends on the number of crystal structures.

PROPUESTA ECONÓMICA

Ítem	Qty	Referencia	Descripción	Precio
01	01	9430 670 00011	Aeris Research. Easy-to-use, upgradeable benchtop X-ray powder diffractometer for rapid phase analysis in a multi-user environment. The system is configured in Bragg-Brentano geometry with a radius of 145 mm. The unique combination of the 300 W high voltage generator operating at 40 kV / 7.5 mA, the Empyrean X-ray tube Cu LFF and the highly acclaimed PIXcel1D line detector makes the system fast and precise. The touch display and the external loading of samples makes the system extremely easy to operate. Included are beta-filters Ni; sample spinner for 51.5 mm sample holders; Soller slits 0.04 rad; fixed slit optics and a set of three powder sample holders. 9430 870 01451 Compact XRD Cabinet equipped with 9430 070 85401 Soller slits 0.04 rad 145mm radius theta-theta goniometer 9430 030 85411 Soller slits large 0.04 rad 300 W generator (40 kV / 7.5 mA) 9430 070 91001 FDS/FASS combination 9430 070 69922 Stage exchange tool set 9430 860 18501 PIXcel1D MPX3 with interface 9430 033 73105 Empyrean tube Cu LFF HR 9430 018 11001 Holder powder sample ring (3x) 9430 031 51031 Beta-filter Ni 9430 018 11271 Powder sample ring 27 mm (3x) 9430 031 58031 Large beta-filter Ni 9430 017 70101 Sample preparation tools 9430 070 64001 Sample spinner for 51.5 mm sample holders 9430 032 80921 Aeris instrument suite 9430 070 30001 Sample platform 9430 032 81921 XRDMP creator suite	
02	01	9430 032 48921	Plus option HighScore ED Plus option HighScore ED	

			The PLUS option for HighScore adds advanced analytical capabilities such as whole pattern fitting (Rietveld, Pawley, and LeBail techniques) for quantification and structure refinement, quantification using the Direct Derivative Method, expanded statistical Cluster analysis, unit cell indexing and space group testing, structure solution by charge flipping, line profile analysis, expanded automation using Pascal scripts, and more. A single purchase of the PLUS option upgrades all licenses of HighScore owned	
03	01	9430 032 09721	HIGH SCORE LTU ED Performs data treatments and XRD phase identification on various systems. Allows installation of the software on one additional device. Data input and output is by files (all PANalytical and many competitor formats). This product requires a reference database for phase identification; options are ICDD PDF2, PDF4+/Minerals/Organics, PDF5+, CCDC CSD and the free COD (http:// www.crystallography.net/new.html). Includes the following features: - Search-match algorithm uses peak and profile data - Auto-residue scoring - Advanced reporting functions - Graphics for examining, displaying, and editing diffractograms - Supports any number of user-defined reference databases - Includes batch feature for auto function of a sequence - Automation ready - can be launched from a command prompt - Similarity analysis of scans (cluster analysis up to 50 scans) - Referenced Intensity Ratio (RIR) for estimation of quantities of all identified phases - Percent crystallinity - Very fast profile fitting - Line profile analysis, microstructure analysis by profile fits - PLS partial least squares to determine/quantify one property directly from raw Data HighScore(Plus) is designed for the Windows 8.1 and 10 Professional (64- bit) operating systems. The software might run under other Windows operating systems as well, but this is not officially supported. Version for degree-granting institutions only.	
04	01	9430 018 12001	SAMPL.HLDR.IRR.SHAPES Set of 3 sample holders for solid samples with maximum diameter 44mm and maximum thickness 6.5mm. Can hold a variety of solid pieces or mounting plates using wax or plasticine. The sample holder is standard 51.4mm diameter circular	

			footprint for sample stages such as reflection-transmission spinner and sample changer.	
05	01	9430 018 17321	SI SUBSTRATE, ZERO BACKGROUND 32MM (SET OF 2) Set of 2 Zero Background Holders made from 32mm diameter silicon single crystal substrates. The silicon substrate is off-cut so that it does not diffract during routine Bragg-Brentano geometry measurements using Cu radiation. One side of the substrate is flat while the other side has a recess of 15mm diameter x 0.2mm deep. Zero background holders are used to mount small amounts of powder using dusting, smear, slurry, and similar techniques. Can also be used to support fibers, capillaries, and foil samples.	
06	01	9430 500 21061	PDF-5+ LICENCIA ED PDF-5+ es la base de datos de Archivos de Difracción de Polvos™ (PDF®) más completa del mundo, con más de 1000000 entradas. PDF-5+ combina las bases de datos PDF-5+ y PDF-5/Organics del ICDD. PDF-5+ contiene más de 400000 entradas inorgánicas y más de 600000 entradas orgánicas para garantizar que disponga de los datos necesarios para todas sus necesidades de identificación de fases. Cada entrada se revisa editorialmente y se le asignan marcas de calidad, por lo que la base de datos PDF-5+, cuidadosamente seleccionada, permite a los usuarios realizar análisis cuantitativos mediante cualquiera de tres métodos: análisis de Rietveld, método de relación de intensidad de referencia (RIR) o ajuste de patrón completo. PDF-5+ está diseñado para la identificación precisa de materiales, combinando las exclusivas entradas de datos experimentales y calculados del ICDD. Incluye datos adicionales de las colaboraciones del ICDD con el Centro de Datos Cristalográficos de Cambridge (CSD), el Centro de Información de Materiales de Karlsruhe (ICSD), el Sistema de Datos de Fases de Materiales (LPF) y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).	
07	01	9430 098 71993	Computer DELL OPTIPLEX XE3 This state-of-the-art industrial-grade PC comes with the latest Microsoft Windows operating system. A wired keyboard and mouse are included in the package.	
08	01	9430 500 74151	Monitor A full HD widescreen PC monitor to provide sufficient, high-resolution work space for displaying the Instrument User Software.	
			Precio DDP	$475,972,269
			IVA 19%	$90,434,731
			Total	$566,407,000

NOTAS ADICIONALES	
Instalación	Está incluida en esta oferta
Garantía (s)	1 año
Términos de pago	El pago del equipo deberá ser 100% a 30 días fecha factura a Cecoltec S.A.S

OBSERVACIONES GENERALES

- El equipo se entregará y se instalará en la Universidad Francisco de la Paula Santander Ocaña- UFPSO, ubicada en Norte de Santander-Ocaña.
- Dentro de la oferta de Cecoltec SAS se ofrecerá una capacitación teórica de difracción de Rayos X por un total de dos (2) días en el sitio de instalación del equipo, totalmente libre de costo.
- El tiempo de instalación y capacitación del personal en el laboratorio será de dos (2) días más.
- La capacitación es en idioma español.
- La instalación del equipo incluye la configuración y validación del instrumento de acuerdo con los procedimientos de Malvern Panalytical.
- El sistema incluye un juego de manuales de operación, calibración y servicio, en donde se incluye un juego de planos del equipo.
- Se incluye un mantenimiento preventivo una vez se termine el año de garantía.
- El computador para el manejo del software está incluido en esta oferta.
- El soporte técnico de la unidad es prestado localmente por Cecoltec S.A.S.
- El pago para opción DDP deberá ser 100% a 30 días fecha factura a Cecoltec S.A.S

DATOS DEL COTIZANTE:
CECOLTEC S.A.S.
191 037 892 92 Cuenta Corriente – Bancolombia
907 612 429 30 Cuenta Corriente – Bancolombia
001 309 430 100 000 158 Cuenta Corriente - BBVA

RESPONSABILIDAD
Cecoltec S.A.S, no responde por lucro cesante que le puedan ser imputables con ocasión del incumplimiento de sus obligaciones, y el monto de los perjuicios indemnizables va máximo hasta el valor de este contrato

Si se tiene alguna duda con relación a la presente por favor no duden en contactarnos.

Cordialmente,

Diana C. Palacio

Diana C. Palacio
Ventas Consultivas y Proyectos
Key Account Manager
Cecoltec S.A.S
dpalacio@cecoltec.com
Carrera 43 A No 18 Sur 135 Of. 732
Tel. 604 3223597
Representantes de Malvern Panalytical para Colombia

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020

COTIZACION DE VENTA

COT-96119

Fecha: 11-05-2026

Asesor: JUAN DAVID CORTES LOPERA
Email: juandavidcortes@kasalab.com
Teléfono: (604) 362 91 87 (601) 354 08 17.
Sitio web: www.kasalab.com
Validez de oferta: 27 de Junio de 2026
Tel asesor: 3012881908

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Contacto: Estefania Correa Muñoz
Email: ecorream@ufpso.edu.co
Teléfono: 305 3922087
Ciudad: Ocaña
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Ítem	Descripción	Imagen	Entrega	Cant	Precio	Valor Total
1	**99-0501-00 - DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X EMMA (ANALIZADOR MEJORADO DE MATERIALES MÚLTIPLES) - GBC.** GBC EMMA THETA/2 THETA XRD		10-12 semanas	1	475,972,000	475,972,000
2	**0000002080 - ESPECTRÓMETRO DE INFRARROJO FTIR INFRALUM FT-08 - LUMEX.**		10-12 semanas	1	203,216,000	203,216,000
3	**L10001 - BASE DE DATOS DE ALDRICH - LUMEX.** 18.513 Espectros de compuestos ATR-FTIR de la colección de Sigma-Aldrich Company		10-12 semanas	1	1	1
4	**5E-C5508 - CALORÍMETRO AUTOMÁTICO 5E-C5508 - 432 .** Cumple con los métodos AS 1038.5, ASTM D5865, ASTM D4809, ASTM E711, BIS 1350, BS EN 15400, GB/T213, GB/T30727, ISO1928, ISO9831, ISO 18125 y ASTM D240 Rango de medición: hasta 50000 J Resolución de temperatura: 0,0001 °C Control: 2 unidades/1 PC disponible Tiempo de análisis por muestra (método dinámico): aproximadamente 10 minutos Método clásico: aproximadamente 15 minutos Tipo de camisa: isoperibólica Estabilidad de la capacidad de calentamiento: =0,2 % en un año Identificación del recipiente: Sí Conexión de equilibrio: Disponible Conexión de red: Disponible Llenado de cubeta: Automático Llenado de oxígeno: Automático Estructura: De sobremesa Elevación del recipiente: Automática Alimentación: Monofásica, CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz, = 500 W Peso neto: 80 kg Dimensiones (L × An × Al): Unidad de análisis: 580 mm × 550 mm × 550 mm; Unidad de control de temperatura: 370 mm × 540 mm × 400 mm * Condiciones de prueba: 1. Temperatura ambiente: 20 °C ± 1 °C, humedad: 75 % ± 5 %; 2. Ausencia de fuentes de interferencia fuertes cercanas; 3. Circuito de agua limpio con agua destilada; 4. Consultar la precisión de diez pruebas de calibración aceptables.		90 dias	1	135,158,000	135,158,000

OBSERVACIONES

TIEMPOS DE ENTREGA SALVO VENTA PREVIA Y/O SUJETO A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD DE FABRICA.

Al aceptar esta cotización, usted acepta nuestras políticas. Puede consultarlas en nuestro sitio web o a través del siguiente enlace: https://kasalab.com/politicas-kasalab/



Gerente General

SUBTOTAL:	**$ 814,346,001**
TOTAL, IVA 19%:	**$ 154,725,740**
DESCUENTO:	**$ 0**
TOTAL:	**$ 969,071,741**

CONFIGURACIÓN OFERTADA:

Referencia	Descripción	Cant.
99-0501-00	GBC EMMA THETA/2 THETA XRD	**1**
99-0510-00	BASE CABINET ON CASTORS FOR ATTACHING TO EMMA STANDARD CABINET	**1**
99-0504-00	AUTOSAMPLE LOADER FOR 10 SAMPLES. INCLUDES SAMPLE HOLDER KIT, AXES 3 AND 4 FOR THE CONTROLLER, SOFTWARE AND CABLE SET.	**1**
54-0604-00	HOLDER, LOW BACKGROUND	**1**
96-0101-00	WATER CIRCULATOR UNIT	**1**
31-0514-00	XRD MATCH SOFTWARE WITH CRYSTALLOGRAPHY OPEN DATABASE - ACADEMIC SINGLE LICENSE	**1**
31-0279-00	ICDD DATABASE PDF-4 MINERALS CURRENT YEAR RELEASE COMMERCIAL.	**1**
95-0705-00	RECOMMENDED SPARES AND CONSUMABLES FOR EMMA	**1**
PC-NAL	COMPUTADOR DESKTOP	**1**

DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X EMMA (ANALIZADOR MEJORADO DE MATERIALES MÚLTIPLES)

Equipo de tamaño compacto, ofrece capacidades mejoradas para el usuario final. El diseño original del EMMA incluía características tales como haz paralelo intercambiable y geometrías de enfoque, radio variable, disposición para detectores múltiples, óptica intercambiable y muchas etapas diferentes.



Dimensiones

1100 mm ancho x 750 mm fondo x 1830 mm alto
Peso embalado aprox. 400 kg
Peso aproximado. 225 kg

Características

Generador de rayos X

Frecuencia media, tipo IGBT, 3kW, 60 kV, 80 mA, estabilidad 0,005 % para un cambio del 10 % en la tensión de alimentación

Tubos de rayos X

Material de vidrio
- Foco largo-fino Cu (0,4 x 12 mm) estándar
- Ánodos Cu, Co, Cr, Fe
- Potencia 2,2 kW para Cu

Goniómetro

- Caja de cambios armónica coaxial doble
- Ejes independientes
- Tamaño de paso mínimo cada eje 0.002°
- Reproducibilidad <0.0001°
- Juego cero -
- Radio 180-250 mm
- Rango máximo -12 a +160° dependiendo de la configuración

Óptica de haz primario

- Montaje de rendija de divergencia con rendija de Soller - Rendija automática con rendija de Soller
- Óptica policapilar para haz paralelo
- Resonador de guía de ondas de rayos X PXWR

Óptica de haz secundario

(Detectores y Óptica)
- Rendija de dispersión para que coincida con la rendija de divergencia
- Ranura de dispersión automática
- Detector de haz paralelo con Soller largo
- Monocromador de grafito curvo

Detectores y Contadores Electrónicos

- Detector proporcional Xe para geometría de enfoque con monocromador Graphite
- Detector proporcional Xe para geometría de haz paralelo

- Detector de estado sólido multibanda de alta velocidad, MtriX

Etapas de muestra

- Platina estándar para 53 mm de diámetro. Soportes Estándar
- Platina giratoria para 53 mm de diámetro. portamuestras
- Platina de muestra a granel, para muestras de 150 mm x 20 mm, máx. peso 3 kg
- Platina de muestra a granel para 50 mm x 150 mm muestras
- Etapa Spinner capilar

Diagnóstico remoto

El software fácil de instalar y fácil de usar permite que GBC le brinde un completo diagnóstico remoto de instrumentos en línea y resolución de problemas. El Emma tiene una dirección IP, por lo que se puede controlar desde cualquier lugar en Internet (si lo permiten los cortafuegos, etc.).

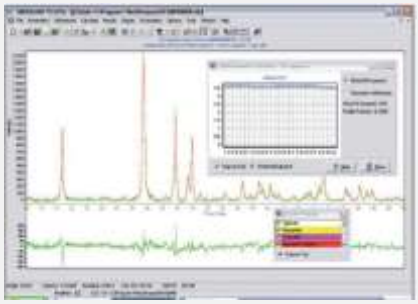
Requisitos eléctricos

220-240 V CA, 50/60 Hz, 20 amperios
Se necesitará un autotransformador clasificado para 3 kW si solo hay disponible 110 V CA
Temperatura ambiente 10°C - 35°C
Humedad de funcionamiento (relativa): 5% a 95%

UNIDAD DE CIRCULACIÓN DE AGUA

Capacidad de enfriamiento nominal: 2600W (25 °C)
Rango de temperatura de salida: 5 ~ 35 ° C
Precisión de temperatura: ± 0,1 ° C
Tamaño del tanque: 26 L
Presión de salida: 0,57 MPa
Flujo de salida: 6 L / min
Filtración: 10 ?m
Consumo de energía: 1 kW
Peso: 84 kilogramos
Ruido: 45 dB
Tamaño (W × D × H): 490 × 580 × 820 mm
Dimensiones: 360 x 565 x 860 mm
Alarmas: nivel de agua, temperatura alta y baja del agua.

SOFTWARE VISUALXRD



- Operación de rutina simple
- Guardar archivos y recuperar conjuntos de parámetros
- Configuración de software para configurar la carpeta de usuario
- Configuración de hardware para tubo de ánodo
- Configuración de accesorios para seleccionar opciones intercambiables
- Control manual para alineación asistida por computadora
- Análisis de altura de pulso utilizado con Xe detector proporcional
- Modos de recopilación de datos: único, paso múltiple, rango múltiple, 0/20, solo 0, solo 20
- Escaneo continuo, escalonado, tensión residual, textura (Texture requiere el paquete de software VisTex)

- Procesar escaneos de Emma y otros fabricantes.
- Botones de herramientas con información sobre herramientas y menús
- Zoom, desplazamiento y etiquetado gráfico de picos
- 16 millones de colores con gráfico selección
- Trabaje con hasta 50 escaneos
- Perspectiva de gráficos 3D, líneas de tendencia, etc.
- Ajuste y desmontaje de fondo cúbico automático y manual
- Exportar escaneos en muchos formatos
- Manipulación de escaneos, agregar, restar, recortar, eliminar picos
- Alisado, cúbico, pelado Ka2
- Área de pico, con cuantificación, Escala logarítmica, activar/desactivar
- Determinación de FWHM de pico, tamaño de partícula por método de Scherrer
- Buscar marcadores de línea PDF-4+, PDF-1, PDF-2 y PDF-4+ mostrados

- Modo de vista previa de impresión Visualización 2D y 3D
- Imprima tarjetas PDF desde PDF-2 y PDF-4+
- Anchos de línea, estilos de línea y fuentes seleccionables
- Generador de patrón de polvo
- Ajuste de picos y deconvolución
- Menos cuadrados o algoritmo genético
- Refinamiento Rietveld

-Sistema completo de AYUDA de Windows y manual incluidos
- Se conservan todos los colores de escaneo y los colores de figuras de palos de PDF
- Funciones comunes con el botón derecho del mouse
- Austenita retenida, con recopilación de datos VisualXRD
- Estrés residual, con recopilación de datos VisualXRD

-Base de datos ICDD PDF-4 Minerales.

CARGADOR AUTOMÁTICO DE MUESTRAS

El cargador automático de muestras (para 10 muestras) incluye un kit de portamuestras, ejes 3 y 4 para el controlador, software y juego de cables.



EQUIPO DESKTOP MARCA DELL

Procesador COREI7-12700 12va Generación
Memoria RAM 16GB
Almacenamiento: Disco Sólido 512GB PCI SOLIDO
Sistema Operativo WINDOWS 11 PROFESIONAL
E2020H MONITOR DELL 20" Altura Fija Resolución 1920 x 1080
Puertos 1 DisplayPort, 1 x VGA
Teclado, Mouse

